# ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»

Отчёт по лабораторной работы 4.3.1 ИЗУЧЕНИЕ ДИФРАКЦИИ СВЕТА

Выполнил студент:

Сериков Василий Романович

группа: Б03-102

#### Аннотация

## Цель работы:

Исследовать явления дифракции Френеля и Фраунгофера на одной и двух щелях.

## В работе используется:

Оптическая скамья, ртутная лампа, монохроматор, щели с регулируемой шириной, рамка с вертикальной нитью, двойная щель, микроскоп на поперечных салазках с микрометрическим винтом, зрительная труба.

## Теория:

## А. Дифракция Френеля

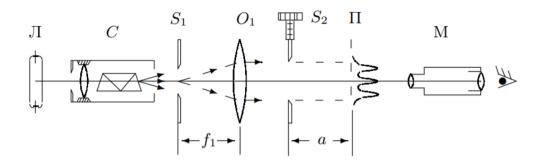


Рис. 1: Схема установки 1.

Схема установки представлена на Рис. 1. Световые лучи освещают щель  $S_2$  и испытывают на ней дифракцию. Дифракционная картина рассматривается с помощью микроскопа M, сфокусированного на некоторую плоскость наблюдения  $\Pi$ . Щель  $S_2$  освещается параллельным пучком монохроматического света с помощью коллиматора, образованного объективом  $O_1$  и щелью  $S_1$ , находящейся в его фокусе. На  $S_1$  сфокусированно изображение спектральной линии, выделенной из спектра ртутной лампы  $\Pi$  при помощи монохроматор C, в котором используется призма прямого зрения.

Распределение интенсивности света в плоскости  $\Pi$  рассчитаем с помощью зон Френеля. При освещении  $S_2$  параллельным пучком лучей (плоская зона) зоны Френеля представляют собой плоскости, параллельные краям щели. Результирующая амплитуда в точке наблюдения определеяется суперпозицией колебаний от тех зон Френеля, которые не перекрыты створками щели. Графическое определение результирующей амплитуды производится с помощью векторной диаграммы — спирали Корню. Суммарная ширина m зон Френеля  $z_m$  определяется соотношение

$$z_m = \sqrt{am\lambda},\tag{1}$$

где a – расстояние от щели до плоскости  $\Pi$ . Вид наблюдаемой картины определяется uucnom  $\Phi penens$   $\Phi$ :

 $\Phi^2 = \frac{D}{\sqrt{a\lambda}}$ 

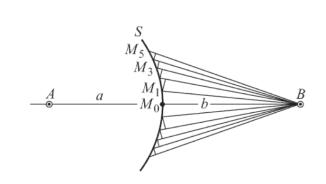
— число зон Френеля, которые укладываются в ширине щели  $D. p = \frac{1}{\Phi^2}$  называется волновым параметром. Дифракционной картины нет, когда  $\Pi$  совпадает с плоскостью щели. При малом удалении от щели  $\Phi \gg 1$  и картина наблюдается в узкой убласти на границе света и тени у краёв экрана. При последующих удалениях две группы дифракционных полос перемещаются независимо и каждая образует картину дифракции Френеля на экране. Распределение интенсивности может быть найдено с помощью спирали Корню. При дальнейшем увеличении a две системы полос сближаются и накладываются друг на друга, распределение интенсивности определяется числом зон Френеля в полуширине щели. Если их m, то будет набюдаться m-1 тёмная полоса.

## Б. Дифракция Фраунгофера на щели

Для выкладок ниже нам потребуется знать  $npunuun\ \Gamma m irenca-\Phi penena$ . Он формулируется следующим образом:

Каждый элемент волнового фронта можно рассматривать как центр вторичного возмущения, порождающего вторичные сферические волны, а результирующее световое поле в каждой точке пространства будет определяться интерференцией этих волн.

Теперь рассмотрим первое применение этого принципа, получившее название  $мето \partial$  зон  $\Phi$ ренеля



Для этого рассмотрим действие световой волны действующей от точки A в какой-то точке B. В этом случае можно, взяв точку

 $M_0$  в качестве центра (см. рис. 1), построить ряд концентрических сфер, радиусы которых начинаются с b и увеличиваются каждый раз на половину длины волны  $\frac{\lambda}{2}$ . При пересечении с плоским фронтом волны F эти сферы дадут концентрические окружности. Таким образом, на фронте волны появятся кольцевые зоны (зоны Френеля) с радиусами  $r_1, r_2$  и т. д.

Из геометрических соображений посчитав, можно получить, что

$$r_i = i\sqrt{a\lambda} \tag{2}$$

Картина дифракции упрощается, когда ширина щели становится значительно меньше ширины первой зоны Френеля, т.е. если

$$D \ll \sqrt{a\lambda} \tag{3}$$

Рис. 3: К фазовым соотношениям при дифракции Фраунгофера

 $D\sin\Theta$ 

Π

Это условие всегда выполняется при достаточно большом a. В этом случае говорят, что  $\partial u\phi pa\kappa uus \Phi payнгo\phi epa$ . Дифракционную кар-

тину в этом случае называются  $\partial u\phi pa\kappa uueu \Phi paynro\phi epa$ . При выполнении пункта (2) у нас упрощаются фазовые соотношения, что поясняет рис. 2, в итоге с хорошим приближением можно считать, что разность хода между крайними лучами, приходящими от щели в точке наблюдения P, с хорошим приближением равна

$$\Delta = r_2 - r_1 \approx D \sin \theta \approx D \cdot \theta \tag{4}$$

Здесь предполагается, что  $\theta$  достаточно мал. Дифракцию Фраунгофера можно наблюдать на установке Рис. 1, но для удобства к подобной установке добавляется объектив  $O_2$ .

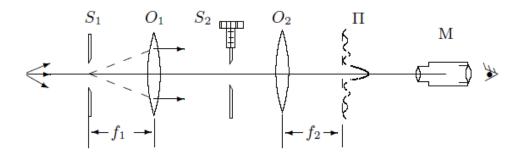


Рис. 4: Схема установки 2.

Дифракционная картина здесь наблюдается в фокальной плоскости объектива  $O_2$ . Каждому значению  $\theta$  соответствует в этой плоскости точка, отстоящая от оптической оси на расстоянии

$$X = f_2 \tan \theta \approx f_2 \theta. \tag{5}$$

Объектив не вносит разности хода между интерферирующими лучам, поэтому в его фокальной плоскости наблюдается неискажённая дифракционная картина. При  $\theta=0$  разность хода между лучами нулевая, поэтому в центре поля зрения дифракционный максимум. Первый минимум соответствует  $\theta_1$  такому, что в точке наблюдения разность хода пробегаем все значения от 0 до  $2\pi$ . Аналогично рассуждая, для m-й полосы

$$\theta_m = \frac{m\lambda}{D} \tag{6}$$

Расстояние  $X_m$  тёмной полосы от оптической оси из (5) и (6)

$$X_m = f_2 m \frac{\lambda}{D} \tag{7}$$

## В. Дифракция Фраунгофера для двух щелей

Для наблюдения дифракции Фраунгофера на двух щелях  $S_2$  заменим экраном  $\Theta$  с двумя щелями. При этом для оценки влияния ширины входной щели на чёткость вместо  $S_1$  поставим щель с микрометрическим винтом. Два дифракционных изображения входной щели, одно из которых

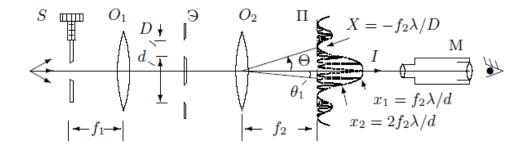


Рис. 5: Схема установки 3.

образовано лучами, прошедшими через левую, а другое – через правую щели, накладываются друг на друга. Если входная щель достаточно узка, то дифракционная картина в плоскости П

подобна той, что получалась при дифракции на одной щели, однако вся картинка испещерена рядом дополнительных узких полос, наличие которых объясняется суперпозицией световых волн через разные щели. Светлая интерфереционная полоса наблюдается в случаях, когда разность хода равна целому числу длин волн. Таким образом, угловая координата максимума порядка m равна

 $\theta_m = \frac{m\lambda}{d},\tag{8}$ 

где d — расстояние между щелями. Отсюда расстояние между соседними интерфереционными полосами в плоскости  $\Pi$  равно

$$\delta x = f_2 \frac{\lambda}{d} \tag{9}$$

Число интерференционных полос укладывающихся в области центрального максимума равна отношению ширины главного максимума  $\frac{2\lambda f_2}{D}$  к расстоянию между соседними полосами:

$$n = \frac{2\lambda f_2}{D} \frac{1}{\delta f} = \frac{2d}{D}. (10)$$

При дифракции света на двух щелях чёткая система интерференционных полос наблюдается только при достаточно узкой ширине входной щели S. При увеличении ширины картинка пропадает и появляется вновь, но полосы при этом сильно размыты и видны плохо.

#### Г. Влияние дифракции на разрешающую способность оптического инструмента

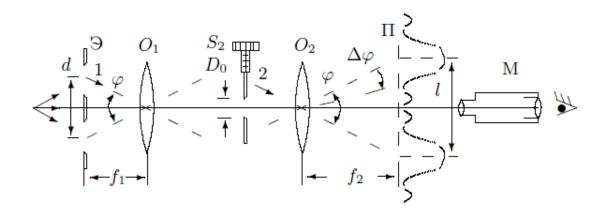


Рис. 6: Схема установки 4.

В отсутствие щели  $S_2$  линзы  $O_1$  и  $O_2$  создают на плоскости  $\Pi$  изоюражение щели  $S_1$  и это изображение рассматриваются микроскопом M. Таким образом, установку можно рассматривать как оптический инструмент, предназначенные для получения изображения предмета. Если перед  $O_2$  расположить  $S_2$ , то изображение объекта будет искажено из-за дифракции. Чем меньше ширина щели, тем сильнее искажение. Качественной характеристикой этого искажения может служить  $\varphi_{min}$  — минимальное угловое расстояние между объектами (источниками), которые всё ещё воспринимаются как раздельные. Поместим вместо  $S_1$  экран  $\Theta$  с двумя щелями с расстоянием d. Тогда на  $S_2$  будут падать два пучка света с углом

$$\varphi = \frac{d}{f_1} \tag{11}$$

Из геометрии расстояние l между изображениями щелей в плоскости  $\Pi$  равно

$$l = \varphi f_2 = d \frac{f_2}{f_1}. \tag{12}$$

Ширина  $\Delta \varphi$  определяется дифракцией на  $S_2$ . Условия, при которых изображения различимы разные для разных наблюдателей, поэтому используют критерий Рэлея — максимум одного дифракционного пятна должен совпадать с минимумом другого. В наших условиях это значит, что угловая полуширина  $\frac{\lambda}{D}$  равна угловому расстоянию  $\frac{l}{f_2}$ .

## Ход работы:

- А. Дифракция Френеля
- 1. Снимем зависимость координаты х микроскопа от числа n, ширину  $z_m$  m зоны Френеля вычислим по формуле (1). Полученные данные занесем в таблицу 1.

| m | х, см | $z_m$ , MKM |
|---|-------|-------------|
| 1 | 5,35  | 171         |
| 2 | 3,0   | 181         |
| 3 | 2,4   | 198         |
| 4 | 2,0   | 209         |
| 5 | 1,7   | 215         |
| 6 | 1,55  | 225         |
| 7 | 1,3   | 227         |

Таблица 1: Полученные значения положения и ширины m зон Френеля.  $\sigma_x=0.05~{\rm cm},~\sigma_{z_m}=10~{\rm mkm}$ 

2. Сравним значение ширины щели измеренной по шкале щели с  $2z_0$ .

$$D = 307 \pm 5$$
mkm  $<=> 2z_0 = 320 \pm 20$ mkm

- Б. Дифракция Фраунгофера на щели
- 3. Измерим с помощью винта поперечного перемещения микроскопа координаты  $x_m$  нескольких дифракционных минимумов (от -m до +m)

| m | $\delta x$ , mm |
|---|-----------------|
| 1 | 0,10            |
| 2 | 0,24            |
| 3 | 0,36            |
| 4 | 0,48            |
| 5 | 0,61            |

Таблица 2: Полученные значения положения дифракционных минимумов

4. Построим график, откладывая по горизонтали номер минимума m, а по вертикали — его координату  $x_m$  (от -m до +m). По углу наклона прямой определим среднее расстояние  $\Delta x$  между соседними минимумами; рассчитаем ширину щели D по формуле (7) и сравним с измеренной.

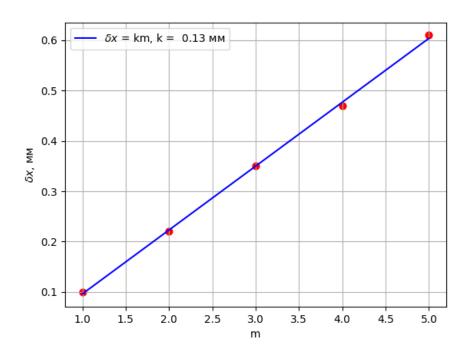


Рис. 7: График зависимости  $\delta x(m)$ .

$$\delta x = f_2 \frac{m\lambda}{D} <=> D = f_2 \frac{\lambda}{k} = 370 \pm 20$$
 мкм

 $D = 309 \pm 5$ мкм, расчет по шкале щели

- В. Дифракция Фраунгофера для двух щелей
- 5. Измерим ширину центрального максимума и количество интерференционных максимумов, которые помещаются в него. Определим ширину щели с помощью формулы (9) и сравним с измеренной по микроскопу величиной.

$$\delta x = f_2 \frac{\lambda}{d} \Longrightarrow d = f_2 \frac{\lambda}{\delta x} = 1, 6 \pm 0, 1$$
mm

 $D=1,28\pm 0,02$  мм, измерено по микроскопу

6. Определим ширину щели  $S_2$  с помощью формулы  $\frac{b}{f_1} = \frac{\lambda}{D}$  и сравним с величиной измеренной микрометром на щели

$$b = \frac{\lambda f_1}{D} = 59 \pm 3 \text{ MKM}$$

 $b = 63 \pm 1$  мкм, измерено с помощью микрометра

- Г. Влияние дифракции на разрешающую способность оптического инструмента
- 7. Проверим разрешающею способность по критерию Рэлея, для этого сравним ширину измеренную по микрометру щели с расчетом по формуле  $\frac{\lambda}{b} < \frac{d}{f_1}$

$$\frac{b}{\lambda} > \frac{f_1}{d} = > b > 59 \pm 3$$
 мкм

## Обсуждение результатов и выводы:

|           | Френель                      | Фраунгофер 1 щель            | Фраунгофер 2 щели         |
|-----------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Расчет    | $D = 307 \pm 5 \text{ мкм}$  | $D = 370 \pm 20 \text{ MKM}$ | $D_1 = 1,6\pm 1$ мкм      |
|           |                              |                              | $b = 59 \pm 3$ мкм        |
| Измерения | $D = 320 \pm 20 \text{ MKM}$ | $D = 309 \pm 5 \text{ MKM}$  | $D_1 = 1,28 \pm 0,02$ мкм |
|           |                              |                              | $b=63\pm1$ мкм            |

Таблица 3: Сравнительная таблица. D - ширина щели  $S_2,\, D_1$  - расстояние между щелями экрана, b - ширина щели  $S_2$ 

В данной работе мы исследовали 2 вида дифракции на щели: Френеля и Фраунгофера. По полученным результатам видно, что теория с практикой сходится не во всех опытах. Можно попробовать объяснить это тем, что система может быть плохо отцентрирована или некачественно сняты показания приборов. Также имеет место качество используемых измерительных приборов.